

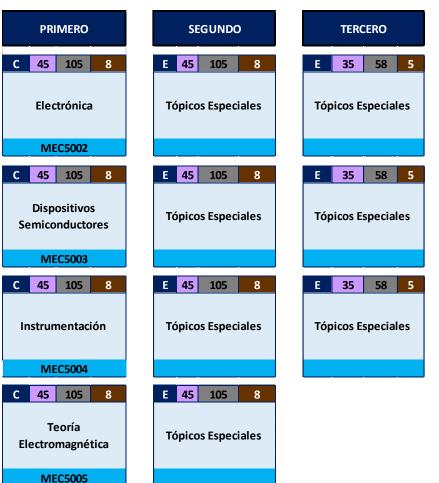


Revisión: 0

Página: 1 de 1

Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES, Medio de verificación 1.2

## MAPA CURRICULAR MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ESPECIADLIDAD DE ELECTRÓNICA



CUARTO								
Т	0	600	30					
Desarrollo de Tesis								
MET5002								







Total, de horas con docente: 495 Total, de horas independientes: 2413

Total, Créditos: 153





Revisión: 0

Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES,

Medio de verificación 1.2

Página: 1 de 1

iviedio de verific	401011 1.2			Horas	Horas		Pagina. i de i
Carácter	Periodo	Asignatura	Créditos	Docente	Independiente	Clave	LGAC
Tronco Común	1	Electrónica	8	45	105	MEC5002	С
Tronco Común	1	Dispositivos Semiconductores	8	45	105	MEC5003	Todas
Tronco Común	1	Instrumentación	8	45	105	MEC5004	Todas
Tronco Común	1	Teoría Electromagnética	8	45	105	MEC5005	Todas
Tópicos Especiales	2	Introducción a Sistemas de Comunicación vía Fibra Óptica	8	45	105	MEE5002	С
Tópicos Especiales	2	Electrónica de Microondas	8	45	105	MEE5003	С
Tópicos Especiales	2	Sistemas Electrónicos de Alta Frecuencia	8	45	105	MEE5004	С
Tópicos Especiales	2	Diseño de Circuitos Integrados Analógicos I	8	45	105	MEE5005	DCI
Tópicos Especiales	2	Diseño de Circuitos Integrados Digitales I	8	45	105	MEE5006	DCI
Tópicos Especiales	2	Técnicas de Simulación de Circuitos Integrados	8	45	105	MEE5007	DCI
Tópicos Especiales	2	Control I	8	45	105	MEE5008	I
Tópicos Especiales	2	Procesamiento de Señales	8	45	105	MEE5009	I
Tópicos Especiales	2	Sistemas Digitales	8	45	105	MEE5010	I
Tópicos Especiales	2	Diseño de Computación Embebida	8	45	105	MEE5011	I





Revisión: 0

Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES,

Medio de verificación 1.2 Página: 1 de 1

nedio de verifica	CIOII I.Z						i agiila. i de i
Tópicos Especiales	2	Física de Semiconductores	8	45	105	MEE5012	М
Tópicos Especiales	2	Física del Estado Sólido	8	45	105	MEE5013	М
Tópicos Especiales	2	Tecnología de Fabricación de dispositivos y CIs	8	45	105	MEE5014	М
Tópicos Especiales	2	Introducción a la tecnología de Microsistemas MEMS	8	45	105	MEE5015	М
Tópicos Especiales	2	Sistemas y Señales	8	45	105	MEE5050	
Tópicos Especiales	2	Tecnologías de fabricación de dispositivos semiconductores	8	45	105	MEE5051	С
Tópicos Especiales	2	Técnicas Optóelectrónicas para sistemas de comunicación de alta frecuencia	8	45	105	MEE5052	
Tópicos Especiales	2	Introducción a Redes Memristivas	8	45	105	MEE5053	
Tópicos Especiales	2	Grafeno	8	45	105	MEE5054	
Tópicos Especiales	2	Ingeniería de computación II	8	45	105	MEE5055	
Tópicos Especiales	2	Sistemas de Microondas	8	45	105	MEE5056	
Tópicos Especiales	2	Física de Superficies y Materiales Semiconductores	8	45	105	MEE5057	
Tópicos Especiales	2	Aplicaciones de películas delgadas en microelectrónica	8	45	105	MEE5058	
Tópicos Especiales	2	Diseño y Pruebas de Circuitos Integrados VLSI	8	45	105	MEE5059	
Tópicos Especiales	2	Líneas de Transmisión, Guías de Onda y Antenas	8	45	105	MEE5060	





Revisión: 0

Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES,

Medio de verifica	ación 1.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Página: 1 de
Tópicos Especiales	2	Nano-Óptica	8	45	105	MEE5061	
Tópicos Especiales	2	Tecnologías Inalámbricas para el Internet de las Cosas	8	45	105	MEE5062	
Tópicos Especiales	2	Aprendizaje Automático	8	45	105	MEE5063	
Tópicos Especiales	2	Fotónica Integrada del grupo IV	8	45	105	MEE5064	
Tópicos Especiales	2	Tecnologías de fabricación de microelectrodos de silicio	8	45	105	MEE5065	
Tópicos Especiales	2	Dispositivos para microfluidos	8	45	105	MEE5066	
Tópicos Especiales	2	Control III	8	45	105	MEE5067	
Tópicos Especiales	2	Sensores de Impedancia Electroquímica	8	45	105	MEE5068	
Tópicos Especiales	2	Introducción a la radio cognitiva	8	45	105	MEE5069	
Tópicos Especiales	3	Dispositivos No Lineales de Alta Frecuencia	5	35	58	MEE5016	С
Tópicos Especiales	3	Interacción de microondas en tejidos biológicos	5	35	58	MEE5017	С
Tópicos Especiales	3	Comunicaciones	5	35	58	MEE5018	С
Tópicos Especiales	3	Laboratorio de Procesamiento de Señales Digitales	5	35	58	MEE5019	С
Tópicos Especiales	3	Aplicación de Procesamiento de Señales Watermarking de señales de Audio	5	35	58	MEE5020	С
Tópicos Especiales	3	Diseño de circuitos integrados analógicos II	5	35	58	MEE5021	DCI





Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES, Código: INAOE-SNP-ME-MP Revisión: 0

Medio de verifica		RIVIAS DE POSGRADO PRESENCIALES,					Página: 1 de 1
Tópicos Especiales	3	Diseño de Circuitos integrados digitales II	5	35	58	MEE5022	DCI
Tópicos Especiales	3	Procesamiento analógico de señales	5	35	58	MEE5023	DCI
Tópicos Especiales	3	Acondicionamiento de sensores resistivos y capacitivos	5	35	58	MEE5024	DCI
Tópicos Especiales	3	Arquitecturas de convertidores AnalógicoDigital y Digital Analógico	5	35	58	MEE5025	DCI
Tópicos Especiales	3	Diseño Automatizado de Circuitos Integrados Analógicos	5	35	58	MEE5026	DCI
Tópicos Especiales	3	Sistemas lineales variantes en el tiempo	5	35	58	MEE5027	DCI
Tópicos Especiales	3	Teoría de Circuitos No Lineales	5	35	58	MEE5028	DCI
Tópicos Especiales	3	Referencias y reguladores de voltaje	5	35	58	MEE5029	DCI
Tópicos Especiales	3	Control II	5	35	58	MEE5030	I
Tópicos Especiales	3	Procesamiento Digital de Señales con FPGA	5	35	58	MEE5031	I
Tópicos Especiales	3	Procesamiento Avanzado de Señales	5	35	58	MEE5032	I
Tópicos Especiales	3	Adquisición y Procesamiento de Bioseñales	5	35	58	MEE5033	I
Tópicos Especiales	3	Reconocimiento de Patrones	5	35	58	MEE5034	I
Tópicos Especiales	3	Dispositivos Semiconductores II	5	35	58	MEE5035	М
Tópicos Especiales	3	Laboratorio de Microelectrónica	5	35	58	MEE5036	М





Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES, Código: INAOE-SNP-ME-MP Revisión: 0

Medio de verifica	ación 1.2						Página: 1 de 1
Tópicos Especiales	3	Fundamentos Físicos de Materiales Nocristalinos y Dispositivos	5	35	58	MEE5037	M
Tópicos Especiales	3	Celdas Solares de Silicio	5	35	58	MEE5038	M
Tópicos Especiales	3	Técnicas de Medición	5	35	58	MEE5039	M
Tópicos Especiales	3	Ingeniería de Computación	5	35	58	MEE5040	
Tópicos Especiales	3	Fundamentos de Procesamiento de Señales Digitales	5	35	58	MEE5041	С
Tópicos Especiales	3	Comunicaciones Digitales	5	35	58	MEE5042	С
Tópicos Especiales	3	Procesamiento de Señales Digitales II	5	35	58	MEE5043	С
Tópicos Especiales	3	Procesamiento Digital de Señales en Tiempo Real	5	35	58	MEE5044	С
Tópicos Especiales	3	Sistemas OFDM	5	35	58	MEE5045	С
Tópicos Especiales	3	Diseño de Computación Embebida	5	35	58	MEE5046	С
Tópicos Especiales	3	Generadores termoeléctricos	5	35	58	MEE5047	
Tópicos Especiales	3	Diseño de Computación Embebida	5	35	58	MEE5048	
Tópicos Especiales	3	Sistemas Embebidos	5	35	58	MEE5049	
Tópicos Especiales	3	Antenas	5	35	58	MEE5070	
Tópicos Especiales	3	Algoritmos de DSP y Comunicaciones Digitales en FPGAs	5	35	58	MEE5074	С





Referencia normativa: ISO 9001:2015, Req. 7.5.2,7.5.3 SNP MARCO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN Y

Revisión: 0

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO PRESENCIALES,

Medio de verificación 1.2 Página: 1 de 1

Tesis	4	Desarrollo de Tesis	30	0	600	MET5002	Todas
Tesis	5	Evaluación de Avances de Tesis	30	0	600	MET5003	Todas
Tesis	6	Escritura y Defensa de Tesis	14	0	280	MET5004	Todas

Líneas de Generación y/ o Aplicación del Conocimiento: LGAC

Comunicaciones C
Diseño de Circuitos Integrados DCI
Instrumentación I
Microelectrónica M